Modele dyskryminacyjne i generatywne

Systemy uczące się - laboratorium

Mateusz Lango

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska

"Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (Al Tech)", projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC.03.02.00-00-0001/20







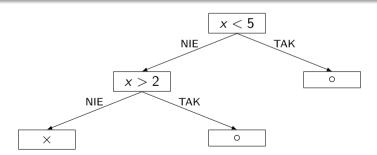


Na ostatnich zajęciach: powtórka drzew decyzyjnych i zasada ERM

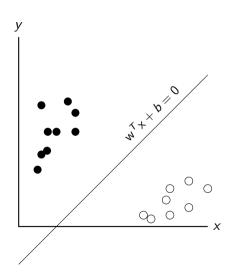
Zasada minimalizacji ryzyka empirycznego

$$\hat{f} = \arg\min_{g \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{dane\ uczace} [L(g(X), Y)]$$

gdzie L to dla klasyfikacji zwykle błąd zero-jedynkowy.



Nowy pomysł na reprezentację wiedzy: klasyfikator liniowy



 Reprezentacja wiedzy w postaci nauczonych wag wyrażenia:

$$g(x) = w^T x + b$$

 Decyzję podejmuje się poprzez porównanie wartości g(x) z pewnym ustalonym (zwykle: nieuczonym) progiem

$$\hat{y} = \begin{cases} 1 & g(x) > 0 \\ 0 & g(x) \le 0 \end{cases}$$

Klasyfikator liniowy – jak się uczyć?

• Zasada minimalizacji ryzyka empirycznego (ang. empirical risk minimization, ERM):

$$\hat{f} = \arg\min_{g \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{dane\ uczace} [L(g(X), Y)]$$

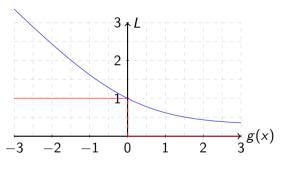
gdzie L to błąd zero-jedynkowy.

ullet Klasa hipotez ${\cal H}$ zawiera wszystkie możliwe wektory wag

$$\mathcal{H} = \{ w : w \in \mathbb{R}^{d+1} \}$$

 ERM w tej sytuacji jest NP-trudny, a także NP-trudne jest uzyskanie aproksymacji do pewnego stałego czynnika

A gdyby tak..



- Możemy spróbować zastąpić w algorytmie błąd 0-1 zastępczą funkcją straty, która będzie go z góry ograniczała
- Zastępczą funkcję straty wybieramy tak aby była wypukła, przez co prosta w optymalizacji
- W przyszłości: od zastępczej funkcji straty zwykle wymagamy dodatkowych własności teoretycznych np. własność kalibracji^a
- Dzisiaj: zobaczymy, że takie funkcje naturalnie pojawiają się przy projektowaniu algorytmów metodami statystycznymi.

^apatrz przedmiot: "Teoria uczenia maszynowego"



Modele generatywne

- Zadanie "uczenia się z danych" możemy przeformułować na zadanie estymowania rozkładu danych $P(\vec{x}, y)$ (gdzie \vec{x} jest wektorem cech)
- Znając rozkład danych można:
 - wygenerować/dolosować więcej danych
 - poznać zależności między cechami i uzyskać ich rozkłady
 - skonstruować rozkład warunkowy:

$$P(y|\vec{x}) = \frac{P(\vec{x}, y)}{P(\vec{x})} = \frac{P(\vec{x}, y)}{\sum_{y} P(\vec{x}, y)}$$

i wybierając najbardziej prawdopodobną klasę uzyskać klasyfikator.

- korzystać z innych zalet przetwarzania rozkładów prawdopodobieństwa
- Zadanie estymacji rozkładu możemy rozwiązywać na wiele sposób: gotowe rozwiązania w statystyce

Zasada maksymalnej wiarygodności (MLE)

 Zasada maksymalnej wiarygodności wybiera/estymuje/uczy się parametrów rozkładu poprzez wybranie takich wartości które maksymalizują funkcje wiarygodności:

$$\hat{\theta} = \argmax_{\theta \in \Theta} L(\theta; \mathbf{x})$$

gdzie (upraszając) $L(\theta; x)$ to prawdopodobieństwo uzyskania próbki wg. modelu o parametrach θ .

- W praktyce maksymalizujemy logarytm z tej funkcji
- Dla modeli generatywnych:

$$\max \ln P(\vec{X}, \vec{y}) \quad \Rightarrow \quad \max \ln \prod_{i=1}^{n} P(\vec{x}_i, y_i) \quad \Rightarrow \quad \max \sum_{i=1}^{n} \ln P(\vec{x}_i, y_i)$$



Przykład obliczeń: uproszczony "Play golf?" [Quinlan '86]

| Outlook | Windy | Play? |
|------------|-------|-------|
| słonecznie | false | 0 |
| słonecznie | true | 0 |
| pochmurnie | false | * |
| deszcz | false | * |
| deszcz | false | * |
| deszcz | true | 0 |
| pochmurnie | true | * |
| słonecznie | false | 0 |
| słonecznie | false | * |
| deszcz | false | * |
| słonecznie | true | * |
| pochmurnie | true | * |
| pochmurnie | false | * |
| deszcz | true | 0 |

Problem

Wyestymuj łączny rozkład prawdopodobieństwa tych danych, zgodnie z zasadą maksymalnej wiarygodności, a następnie oblicz prawdopodobieństwo, że $P(y=\star|słonecznie,false)$. Do jakiej klasy zostałby przydzielony przykład (słonecznie, false) wg. klasyfikatora skonstruowanego na tym prawdopodobieństwie?

Rozwiązanie 1: założenie o normalności danych

Klątwa wymiarowości to zespół zjawisk polegający na wykładniczym wzroście trudności rozwiązywanego problemu uczenia się w zależności od wymiaru przestrzeni.

ullet Rozkład łączny $P(\vec{x}, y)$ możemy rozbić na dwie składowe korzystając z reguły łańcuchowej

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y)$$

• Zakładając rozkład normalny cech pod warunkiem klasy:

$$P(\vec{x}, y) = N(\vec{x}|\vec{\mu}_y, \Sigma_y)P(y)$$

$$N(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\vec{x} - \vec{\mu})^{\top}\Sigma^{-1}(\vec{x} - \vec{\mu})\right)$$

ullet Dla każdej klasy potrzebujemy d średnich (dla każdej cechy) oraz kowariancje między parami cech (rzędu d^2)

Problem

Dlaczego zakładać akurat normalny rozkład danych?

Zadanie

Problem

Zakładając rozkład normalny cech pod warunkiem klasy:

$$P(\vec{x}, y) = N(\vec{x}|\vec{\mu}_y, \Sigma_y)P(y)$$

dokonaj estymacji tego klasyfikatora zgodnie z zasadą maksymalnej wiarygodności, a następnie podaj wyrażenie na $P(+|x_1=3,x_2=0)$.

| <i>x</i> ₁ | <i>x</i> ₂ | у |
|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | -2 | + |
| 2 | 0 | + |
| 3 | 2 | + |
| 1 | 5 | - |
| 1 | -5 | - |

Liniowa analiza dyskryminacyjna

 Ze względu na liczbę parametrów potrzebną do estymowania macierzy kowariancji, często wprowadzamy założenie że macierz kowariancji jest wspólna dla każdej klasy

$$P(\vec{x}, y) = N(\vec{x}|\vec{\mu}_y, \Sigma)P(y)$$

- ullet Dla każdej klasy potrzebujemy d średnich (dla każdej cechy) oraz dodatkowo jedną macierz kowariancji (rzędu d^2)
- Klasyfikator uzyskany z tak wyrażonego rozkładu nazywamy liniową analizą dyskryminacyjną (LDA)¹

¹Zwróć uwagę, że na wykładzie jest ona wyprowadzana jako metoda nadzorowanej redukcji wymiarowości. Prowadzi to również do efektywniejszej implementacji o ile nie interesują nas prawdopodobieństwa, a jedynie uzyskanie predyktora.

Liniowa analiza dyskryminacyjna - estymacja

Zgodnie z założeniami LDA:

$$P(\vec{x}, y) = N(\vec{x}|\vec{\mu}_y, \Sigma)P(y)$$

$$\max \sum_{i=1}^n \ln P(\vec{x}_i, y_i) = \sum_{i=1}^n \ln N(\vec{x}|\vec{\mu}_y, \Sigma) P(y)$$

- Przyrównując pochodną do 0 otrzymujemy:
 - $P(y) = \frac{n_y}{n}$ liczba przykładów z klasy y podzielić przez liczbę wszystkich przykładów
 - $\mu_k = \frac{1}{n_k} \sum_{v_i=k}^n x_i$ dla każdej klasy k
 - $\Sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i \mu_{y_i})(x_i \mu_{y_i})^T$ (tylko 1, współdzielony między klasami) ²

²Standardowo korzystamy z nieobciążonych estymatorów $\Sigma = \frac{1}{n-|C|} \sum_{k=1}^{|C|} \sum_{y_i=k} (x_i - \mu_{y_i}) (x_i - \mu_{y_i})^T$ gdzie C oznacza liczbę klas

Rozwiązanie 2: założenie o warunkowej niezależności cech

ullet Rozkład łączny $P(ec{x},y)$ możemy rozbić na dwie składowe korzystając z reguły łańcuchowej

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y)$$

• Wprowadzając założenie o warunkowej niezależności cech

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y) = P(x_1, x_2, \dots, x_d|y)P(y) = P(x_1|y)P(x_2|y) \cdots P(x_n|y)P(y)$$

Przekształcając na rozkład warunkowy uzyskujemy:

$$P(y|\vec{x}) = \frac{P(\vec{x}, y)}{\sum_{y} P(\vec{x}, y)} = \frac{\prod_{i=1}^{d} P(x_i|y) P(y)}{\sum_{y} \prod_{i=1}^{d} P(x_i|y) P(y)}$$

W literaturze uczenia maszynowego ten model nazywamy klasyfikatorem naiwnego
Bayesa, w literaturze statystycznej...

Rozwiązanie 2: założenie o warunkowej niezależności cech

ullet Rozkład łączny $P(\vec{x}, y)$ możemy rozbić na dwie składowe korzystając z reguły łańcuchowej

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y)$$

• Wprowadzając założenie o warunkowej niezależności cech

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y) = P(x_1, x_2, \dots, x_d|y)P(y) = P(x_1|y)P(x_2|y) \cdots P(x_n|y)P(y)$$

• Przekształcając na rozkład warunkowy uzyskujemy:

$$P(y|\vec{x}) = \frac{P(\vec{x}, y)}{\sum_{y} P(\vec{x}, y)} = \frac{\prod_{i=1}^{d} P(x_{i}|y)P(y)}{\sum_{y} \prod_{i=1}^{d} P(x_{i}|y)P(y)}$$

W literaturze uczenia maszynowego ten model nazywamy klasyfikatorem naiwnego
Bayesa, w literaturze statystycznej...

Rozwiązanie 2: założenie o warunkowej niezależności cech

ullet Rozkład łączny $P(ec{x},y)$ możemy rozbić na dwie składowe korzystając z reguły łańcuchowej

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y)$$

• Wprowadzając założenie o warunkowej niezależności cech

$$P(\vec{x}, y) = P(\vec{x}|y)P(y) = P(x_1, x_2, \dots, x_d|y)P(y) = P(x_1|y)P(x_2|y) \cdots P(x_n|y)P(y)$$

• Przekształcając na rozkład warunkowy uzyskujemy:

$$P(y|\vec{x}) = \frac{P(\vec{x}, y)}{\sum_{y} P(\vec{x}, y)} = \frac{\prod_{i=1}^{d} P(x_i|y)P(y)}{\sum_{y} \prod_{i=1}^{d} P(x_i|y)P(y)}$$

• W literaturze uczenia maszynowego ten model nazywamy klasyfikatorem naiwnego Bayesa, w literaturze statystycznej...

Naiwny Bayes - estymacja

Zgodnie z założeniami NB:

$$P(\vec{x}, y) = \prod_{i=1}^{d} P(x_i|y)P(y)$$

$$\max \sum_{i=1}^{n} \ln P(\vec{x_i}, y_i) = \sum_{i=1}^{n} \ln \prod_{i=1}^{d} P(x_i | y) P(y) = \sum_{i=1}^{n} \left(\ln P(y) + \sum_{i=1}^{d} \ln P(x_i | y) \right)$$

- Przyrównując pochodną do 0 otrzymujemy:
 - $P(y) = \frac{n_y}{n}$ liczba przykładów z klasy y podzielić przez liczbę wszystkich przykładów
 - Dla cech estymatory założonych (jednowymiarowych) rozkładów np.
 - dla cech ciągłych i rozkładu normalnego: zwykła średnia i wariancja
 - dla cech nominalnych i rozkładu kategorycznego: zwykłe zliczanie



Przykład obliczeń: uproszczony "Play golf?" [Quinlan '86]

| Outlook | Windy | Play? |
|------------|-------|-------|
| słonecznie | false | 0 |
| słonecznie | true | 0 |
| pochmurnie | false | * |
| deszcz | false | * |
| deszcz | false | * |
| deszcz | true | 0 |
| pochmurnie | true | * |
| słonecznie | false | 0 |
| słonecznie | false | * |
| deszcz | false | * |
| słonecznie | true | * |
| pochmurnie | true | * |
| pochmurnie | false | * |
| deszcz | true | 0 |

Problem

Wyznacz prawdopodobieństwo $P(y=\star|sionecznie, false)$ zgodnie z klasyfikatorem naiwnego Bayesa, a następnie odpowiedz na pytania:

- Jakich rozkładów prawdopodobieństwa nie możemy się nauczyć (tj. zamodelować)?
- Czy dostrzegasz jakieś wady zaproponowanego podejścia?
- Ile parametrów ma ten klasyfikator?
- Zakładając klasyfikację binarną i d cech binarnych, podaj wzór na liczbę parametrów tego klasyfikatora.

Modele generatywne - podsumowanie

- Modelują rozkład łączny danych
- Odtwarzają proces generowania danych np. "najpierw wybrano dla przykładu klasę z P(y), a potem wygenerowano cechy z rozkładu normalnego tej klasy"
- Klasyfikator uzyskujemy poprzez przekształcenie do rozkładu warunkowego np. regułą Bayesa
 - W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie by przekształcić rozkład tak by przewidywał dowolna zmienną x_i zamiast y!
 - ⇒ Czy nie rozwiązujemy trudniejszego problemu żeby rozwiązać prostszy?

Modele generatywne - podsumowanie

- Modelują rozkład łączny danych
- Odtwarzają proces generowania danych np. "najpierw wybrano dla przykładu klasę z P(y), a potem wygenerowano cechy z rozkładu normalnego tej klasy"
- Klasyfikator uzyskujemy poprzez przekształcenie do rozkładu warunkowego np. regułą Bayesa
 - W zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie by przekształcić rozkład tak by przewidywał dowolną zmienną x_i zamiast y!
 - ⇒ Czy nie rozwiązujemy trudniejszego problemu żeby rozwiązać prostszy?

Modele dyskryminacyjne

- Wyestymujmy bezpośrednio (i tylko) rozkład $P(y|\vec{x})$
- Zgodnie z zasadą maksymalnej wiarygodności:

$$\max \sum_{i=1}^n \ln P(y_i|\vec{x_i})$$

• Dla problemu regresji możemy założyć, że $P(y|\vec{x})$ jest jednowymiarowym (!) rozkładem normalnym, a jego średnią możemy wyznaczyć wyrażeniem liniowym \Rightarrow typowa regresja liniowa

$$P(y|\vec{x}) = N(y|\mu_x = w^T x + b, \sigma)$$

ullet Dla problemu klasyfikacji binarnej y jest zmienną 0/1, co w naturalny sposób prowadzi nas do rozkładu Bernoulliego

$$P(y|\vec{x}) = B(y|p_x = ?w^Tx + b?) = p_x^y(1 - p_x)^{(1-y)}$$

Modele dyskryminacyjne

- Wyestymujmy bezpośrednio (i tylko) rozkład $P(y|\vec{x})$
- Zgodnie z zasadą maksymalnej wiarygodności:

$$\max \sum_{i=1}^n \ln P(y_i|\vec{x_i})$$

• Dla problemu regresji możemy założyć, że $P(y|\vec{x})$ jest jednowymiarowym (!) rozkładem normalnym, a jego średnią możemy wyznaczyć wyrażeniem liniowym \Rightarrow typowa regresja liniowa

$$P(y|\vec{x}) = N(y|\mu_x = w^T x + b, \sigma)$$

ullet Dla problemu klasyfikacji binarnej y jest zmienną 0/1, co w naturalny sposób prowadzi nas do rozkładu Bernoulliego

$$P(y|\vec{x}) = B(y|p_x = ?w^Tx + b?) = p_x^y(1 - p_x)^{(1-y)}$$

Modele dyskryminacyjne

- Wyestymujmy bezpośrednio (i tylko) rozkład $P(y|\vec{x})$
- Zgodnie z zasadą maksymalnej wiarygodności:

$$\max \sum_{i=1}^n \ln P(y_i|\vec{x_i})$$

• Dla problemu regresji możemy założyć, że $P(y|\vec{x})$ jest jednowymiarowym (!) rozkładem normalnym, a jego średnią możemy wyznaczyć wyrażeniem liniowym \Rightarrow typowa regresja liniowa

$$P(y|\vec{x}) = N(y|\mu_x = w^T x + b, \sigma)$$

ullet Dla problemu klasyfikacji binarnej y jest zmienną 0/1, co w naturalny sposób prowadzi nas do rozkładu Bernoulliego

$$P(y|\vec{x}) = B(y|p_x = ?w^Tx + b?) = p_x^y(1 - p_x)^{(1-y)}$$



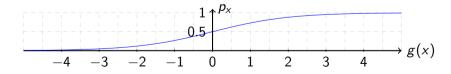
Regresja logistyczna

Załóżmy, że logarytm z szansy jest funkcją liniową³:

$$\mathsf{logit}(p_{\mathsf{x}}) = \mathsf{ln}\, rac{p_{\mathsf{x}}}{1-p_{\mathsf{x}}} = w^{\mathsf{T}}x + b$$

Wyrażając prawdopodobieństwo p_x w zależności od wyniku wyrażenia liniowego $g(x) = w^T x + b$ otrzymujemy:

$$\rho_{\mathsf{x}} = \frac{1}{1 + e^{-g(\mathsf{x})}}$$



³Na przykład: jeśli dane mają warunkowo rozkład normalny ze współdzieloną macierzą kowariancji to tak rzeczywiście iest.

Zadanie

Problem

Próbuje się zamodelować prawdopodobieństwo ataku cybernetycznego w danym dniu przy użyciu liczby ataków z dnia poprzedniego. Otrzymano następujący model regresji logistycznej o współczynnikach b=0.5 oraz w=0.1. Ile wynosi prawdopodobieństwo ataku, jeżeli wczoraj było ich 5?

Regresja logistyczna - estymacja

$$\max_{w,b} \sum_{i=1}^{n} \ln P(y_i | \vec{x}_i) = \sum_{i=1}^{n} \ln \left[p_{x_i}^{y_i} (1 - p_{x_i})^{(1-y_i)} \right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(\ln p_{x_i}^{y_i} + \ln(1 - p_{x_i})^{(1-y_i)} \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \left(y_i \ln p_{x_i} + (1 - y_i) \ln(1 - p_{x_i}) \right)$$

$$gdzie p_{x} = \frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$$

Regresja logistyczna - estymacja

$$\begin{aligned} \max_{w,b} \sum_{i=1}^{n} \ln P(y_i | \vec{x_i}) &= \sum_{i=1}^{n} \ln \left[p_{x_i}^{y_i} (1 - p_{x_i})^{(1 - y_i)} \right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(\ln p_{x_i}^{y_i} + \ln(1 - p_{x_i})^{(1 - y_i)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left(y_i \ln p_{x_i} + (1 - y_i) \ln(1 - p_{x_i}) \right) \end{aligned}$$

gdzie
$$p_X = \frac{1}{1+e^{-(w^Tx+b)}}$$

Regresja logistyczna - estymacja

$$egin{aligned} \max_{w,b} \sum_{i=1}^n \ln P(y_i | ec{x_i}) &= \sum_{i=1}^n \ln \left[p_{x_i}^{y_i} (1 - p_{x_i})^{(1 - y_i)}
ight] \ &= \sum_{i=1}^n \left(\ln p_{x_i}^{y_i} + \ln (1 - p_{x_i})^{(1 - y_i)}
ight) \ &= \sum_{i=1}^n \left(y_i \ln p_{x_i} + (1 - y_i) \ln (1 - p_{x_i})
ight) \end{aligned}$$

gdzie
$$p_{\scriptscriptstyle X}=rac{1}{1+e^{-(w^Tx+b)}}$$

Błąd logistyczny (*)

Przekształcając wzór dalej otrzymujemy:

$$\begin{split} \max_{w,b} \sum_{i=1} \left(y_i \ln p_{x_i} + (1 - y_i) \ln(1 - p_{x_i}) \right) &= \\ &= \sum_{i=1}^n \left(y_i \ln \frac{1}{1 + e^{-g(x)}} + (1 - y_i) \ln(1 - \frac{1}{1 + e^{-g(x)}}) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(y_i \ln \frac{1}{1 + e^{-g(x)}} + (1 - y_i) \ln(\frac{1}{1 + e^{g(x)}}) \right) \\ &= -\sum_{i=1}^n \left(y_i \ln(1 + e^{-g(x)}) + (1 - y_i) \ln(1 + e^{g(x)}) \right) \\ &= -\sum_{i=1}^n \ln \left(1 + e^{-y_i^*g(x)} \right) \end{split}$$

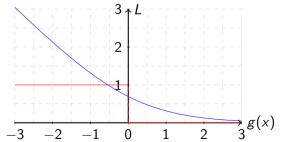
W ostatniej linijce zostało zmienione kodowanie klas $y_i^* \in \{-1,1\}$.

Błąd logistyczny

Przekształcając wzór dalej otrzymujemy:

$$\min_{\mathbf{w},b} \sum_{i=1}^{n} - (y_i \ln p_{x_i} + (1-y_i) \ln(1-p_{x_i})) = \sum_{i=1}^{n} \ln \left(1 + e^{-y_i^* g(x)}\right)$$

przy czym zostało zmienione kodowanie klas $y_i^* \in \{-1,1\}$.



- Błąd tej postaci nazywamy błędem logistycznym (ang. logistic loss).
- Zauważ, że formulacja jest ogólna i za g(x) można wstawić inny model wiedzy niż wyrażenie liniowe, uzyskując inny algorytm wykorzystujący tę funkcję błędu.

Wykonajmy kilka przekształceń wzoru na klasyfikator Naiwnego Bayesa.

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}$$

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{\frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}}$$

Wykonajmy kilka przekształceń wzoru na klasyfikator Naiwnego Bayesa.

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}$$

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{\frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}}$$

Wykonajmy kilka przekształceń wzoru na klasyfikator Naiwnego Bayesa.

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}$$
$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + \frac{P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}}$$

Wykonajmy kilka przekształceń wzoru na klasyfikator Naiwnego Bayesa.

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}$$
$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{\ln\left(\frac{P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}\right)}}$$

Wykonajmy kilka przekształceń wzoru na klasyfikator Naiwnego Bayesa.

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}$$

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{\ln\left(\frac{P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}\right)}}$$

$$P(Y = 1|X) = f\left(-\ln\frac{P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}\right)$$

Wykonajmy kilka przekształceń wzoru na klasyfikator Naiwnego Bayesa.

$$P(Y = 1|X) = \frac{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1) + P(X|Y = 0)P(Y = 0)}$$

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{\ln\left(\frac{P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}\right)}}$$

$$P(Y = 1|X) = f\left(-\ln\frac{P(X|Y = 0)P(Y = 0)}{P(X|Y = 1)P(Y = 1)}\right)$$

Dla cech binarnych:

$$\ln \frac{P(X|Y=0)P(Y=0)}{P(X|Y=1)P(Y=1)} = \ln \left(\frac{P(Y=1)}{P(Y=0)}\right) + \sum_{i=1}^{m} \ln \frac{P(X_i=0|Y=1)}{P(X_i=0|Y=0)}$$

$$+ \sum_{i=1}^{m} \left(\ln \frac{P(X_i=1|Y=1)}{P(X_i=1|Y=0)} - \ln \frac{P(X_i=0|Y=1)}{P(X_i=0|Y=0)}\right) X_i$$
(1)

$$= w_0 + \sum_{i=1}^m w_i x_i$$

Związek między LDA a Regresją Logistyczną

Dla rozkładu normalnego z jednostkową macierzą kowariancji:

$$\ln \frac{P(X|Y=0)P(Y=0)}{P(X|Y=1)P(Y=1)} = \underbrace{\ln \frac{P(1)}{P(0)} - \frac{1}{2}(||\mu_1||^2 + ||\mu_0||^2)}_{w_0} + \underbrace{(\mu_1^T - \mu_0^T)}_{w_0} x$$
(2)

Analogiczną zależność można pokazać dla rozkładu normalnego ze współdzieloną między klasami macierzą kowariancji.

W ogólności taki zapis nie jest możliwy dla dowolnego rozkładu!



- Oba klasyfikatory mają tę samą formę (dla pewnych przypadków)
- Oba klasyfikatory używają zasady maksymalnej wiarygodności do wytrenowania parametrów
- Różnica:
 - ullet NB/LDA optymalizuje MLE rozkładu łącznego P(x,y)
 - LR optymalizuje MLE rozkładu warunkowego P(y|x)
- Które z tych podejść jest lepsze?

- Oba klasyfikatory mają tę samą formę (dla pewnych przypadków)
- Oba klasyfikatory używają zasady maksymalnej wiarygodności do wytrenowania parametrów
- Różnica:
 - NB/LDA optymalizuje MLE rozkładu łącznego P(x, y)
 - ullet LR optymalizuje MLE rozkładu warunkowego P(y|x)
- Które z tych podejść jest lepsze?

- Oba klasyfikatory mają tę samą formę (dla pewnych przypadków)
- Oba klasyfikatory używają zasady maksymalnej wiarygodności do wytrenowania parametrów
- Różnica:
 - NB/LDA optymalizuje MLE rozkładu łącznego P(x, y)
 - ullet LR optymalizuje MLE rozkładu warunkowego P(y|x)
- Które z tych podejść jest lepsze?

Twierdzenie (Ng, Jordan)

Niech h_{Gen} i h_{Dys} będą parą klasyfikatorów generatywny-dyskryminacyjny, a poprzez h_{Gen}^* i h_{Dys}^* oznaczmy ich wersje populacyjne^a. Wtedy

$$\epsilon(h_{Dys}^*) \leq \epsilon(h_{Gen}^*)$$

^awyobraź sobie nieskończony zbiór danych

Problem

Wykorzystując poniższe pytania wskaż na wady i zalety podejść dyskryminacyjnych i generatywnych.

- Łatwy do nauczenia?
- Latwo dodać nową klasę?
- Latwo obsłużyć brakujące dane?
- Łatwo wykorzystać niezaetykietowane dane podczas uczenia?
- Łatwo wykorzystać przetworzone cechy?
- Dobrze wykalibrowane prawdopodobieństwa?

Zadanie

Problem

Przeanalizuj modele LDA, naiwnego Bayesa i regresji logistycznej w kontekście zasady minimalizacji ryzyka empirycznego. Jakie są klasy hipotez? Jak jest optymalizowana funkcja? Jaki algorytm optymalizacyjny może być stosowany?

Dziękuję za uwagę!





Rzeczpospolita Polska Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

